**ODAKLAMALI İYON DEMETİ (FIB) / ANALİZ TALEP FORMU**

**TEKNİK BİLGİLER**

|  |
| --- |
| **☐ TEM Numunesi Hazırlama** **☐ Kesitleme/Görüntüleme**☐ İkincil Elektron Görüntüsü (SE-I) ☐ Geri Saçılımlı Elektron Görüntüsü (BSE-I)☐ EDX Spektral Analiz ☐ EDX Haritalama Analizde tespit edilmesi beklenen elementler:  |

**TALEBİN AMACI** : (Lütfen projenizin bilimsel amacını açıklayınız, FIB kullanarak hangi sorunu çözmek istediğinizi yazınız; **maksimum 500 kelime)**

|  |
| --- |
|  |

**YAPILMIŞ OLAN ÖN DENEYLER (talep sahibi tarafından, lütfen literatürden alıntılar vermeyiniz.):**

|  |
| --- |
|  |

**BEKLENEN SONUÇLAR:** (Lütfen FIB kullanarak elde etmek istediğiniz sonuçları, beklediğiniz olası cevapları açıklayınız, **maksimum 500 kelime**)

|  |
| --- |
|  |

[ ]  Lütfen araştırma konusu ile ilgili önemli yayınlar ekleyiniz.

**ÖZEL ÖRNEK HAZIRLAMA:** Lütfen metal kaplama veya mekanik numune hazırlama (kesme vs.) gerekliliklerine ihtiyacınız olup olmadığını belirtiniz. Evet ise açıklayınız.

|  |
| --- |
|  |

**ÖRNEK BİLGİLERİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Analiz edilecek örneklerin sayısı** |  |
| **Örnek etiket isimleri ve kompozisyonları** | 1- |
| 2- |
| 3- |
| **Örnekteki ilgilenilen bölgenin büyüklüğü nedir? (birimi belirtin)** |  |
| **Örnek saklama koşulları** **(ışık, sıcaklık vs.)** |  |
| **Örnek türü** | [ ]  Inorganik [ ]  Organik |
| **Örnek özellikleri** | [ ]  Toz [ ]  Ince film [ ]  Katı/kalın[ ]  Kompozit[ ]  Manyetik[ ]  Islak[ ]  Toksik |
| **Kullanılmayan numunenin iade edilmesini istiyorum****Analiz edilen numunenin iade edilmesini istiyorum** |  [ ]  Evet [ ]  Hayır [ ]  Evet [ ]  Hayır |
| **Bu örnekle, insan sağlığına veya ekipmana karşı dikkate alınması gereken güvenlik önlemleri var mı (cevap evet ise, lütfen aşağıda açıklayın, MSDS formlarını ekleyin ve maruz kalma sınırlarını yazın)** |  [ ]  Evet (Lütfen aşağıda açıklayınız) [ ]  Hayır  [ ]  MSDS eki Maruz kalma sınırı: . . . . . . . . .  |

Olası çevresel risk veya güvenlik sorunları:

|  |
| --- |
|  |

**ÖNEMLİ BİLGİLER**

* + - 1. Örnekler farklı formlarda olabilir: bulk, ince film, toz veya kompozit. Sıvı örnekler kabul edilmez / ölçülmez.
			2. Örneklerin numaralandırılması ve etiketlendirilmesi ayrıntılı bir şekilde talep formuna yazılmalıdır. Verilen bilgiler örnekler üzerindeki etiketlerle eşleşmelidir.
			3. **Örneğin alanı 4 cm2’ yi, kalınlığı/yüksekliği 1 cm’ yi** geçmemelidir.Analiz edilecek bölge **derinliği “mikrometre”** düzeyinde olmalıdır.
			4. Analiz süresi, analiz sırasında kullanılacak tekniklere bağlı olarak **bir örnek için 2 saat (minimum) ile 6** **saat** veya daha fazla saat arasında değişir.
			5. Analizden sonra elde edilen dijital veriler **yalnızca** Google Drive üzerinden paylaşılır.
			6. Yayınlar veya konferanslarda SUNUM'da yapılan analizde elde edilen sonuçlar sunulurken, talep edenlerin SUNUM desteğini resmi bir cümle ile duyurmaları gerekmektedir: ***“Bu sonuçlara ulaştıran elektron mikroskopi analizi Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırması ve Uygulama Merkezi – SUNUM’da gerçekleştirilmiştir.”***
			7. SUNUM Elektron Mikroskobu laboratuvarında örneğin incelenmesi için uzman tarafından uygulanacak bazı özel analizlerin sonuçlarının herhangi bir bilimsel yayında kullanılması, ölçüm ve analizi gerçekleştiren **uzmanın adının bilimsel yayına ortak yazarlık** olarak eklenmesini gerektirebilmektedir.
			8. SUNUM, örnek uygun değilse veya form düzgün doldurulmamışsa örneği reddetme hakkına sahiptir. Analizden önce ve sonra uygunsuz örnek, eksik ve yanlış bilgilerden kaynaklanabilecek rahatsızlıklardan SUNUM sorumlu değildir.